Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/617,033	AMADA ET AL.
Examiner	Art Unit
Hai C. Pham	2861

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
347	236-239, 241, 243, 246-247	2/25/2005	НР
	255-261		
		~~~	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · ·

2/25/2005	HP
2/25/2005	НР